

ミューラーマトリクスでさらに進んだ 偏光・位相差解析の世界へ

複屈折測定システム

偏光・位相差測定 / 解析システム



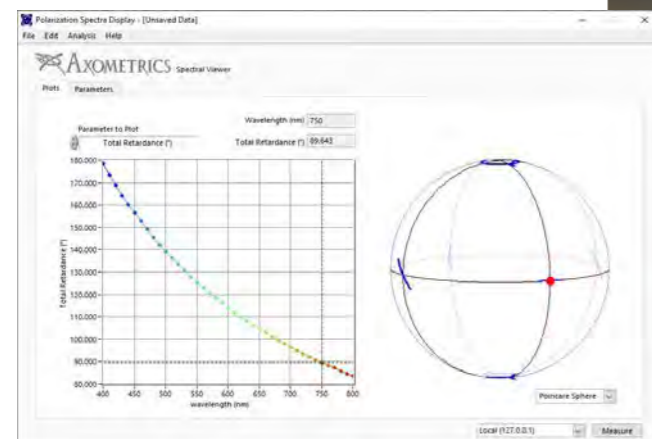
AxoScan

偏光・位相差フィルム、AR/VR用オプティクス、液晶セル、OLED用部材をはじめとした偏光デバイスの計測に広くご使用になれます。光学部材の偏光・位相差特性を一括測定する偏光・位相差測定 / 解析のスタンダードシステムです。

AxoScan

ポラリメーター

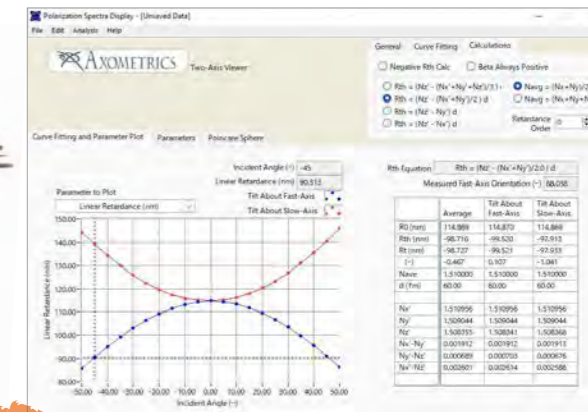
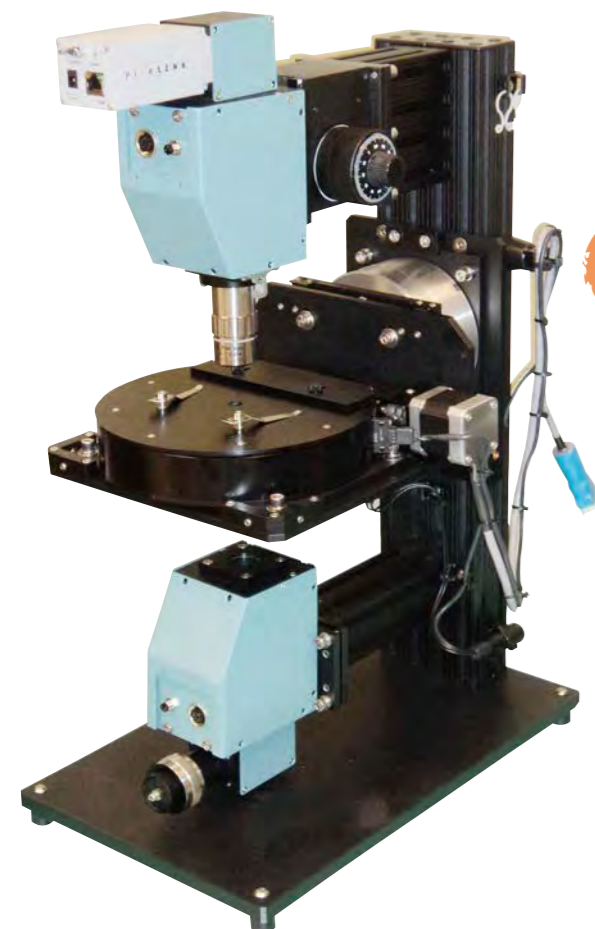
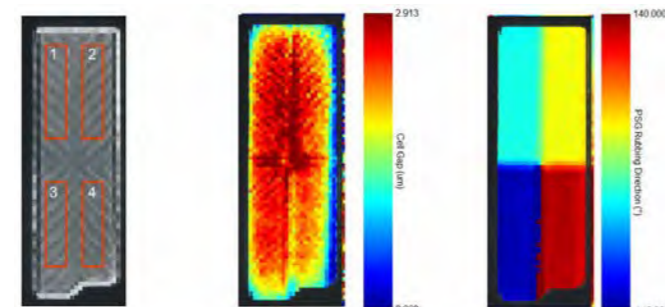
サンプルの持つ偏光特性を数値とポアンカレ球で視覚的に表示。30msの高速測定で、サンプルの偏光・位相差特性を高精度に測定します。高速性と高繰り返し精度を両立した標準モデルです。



AxoStep

イメージングポラリメーター

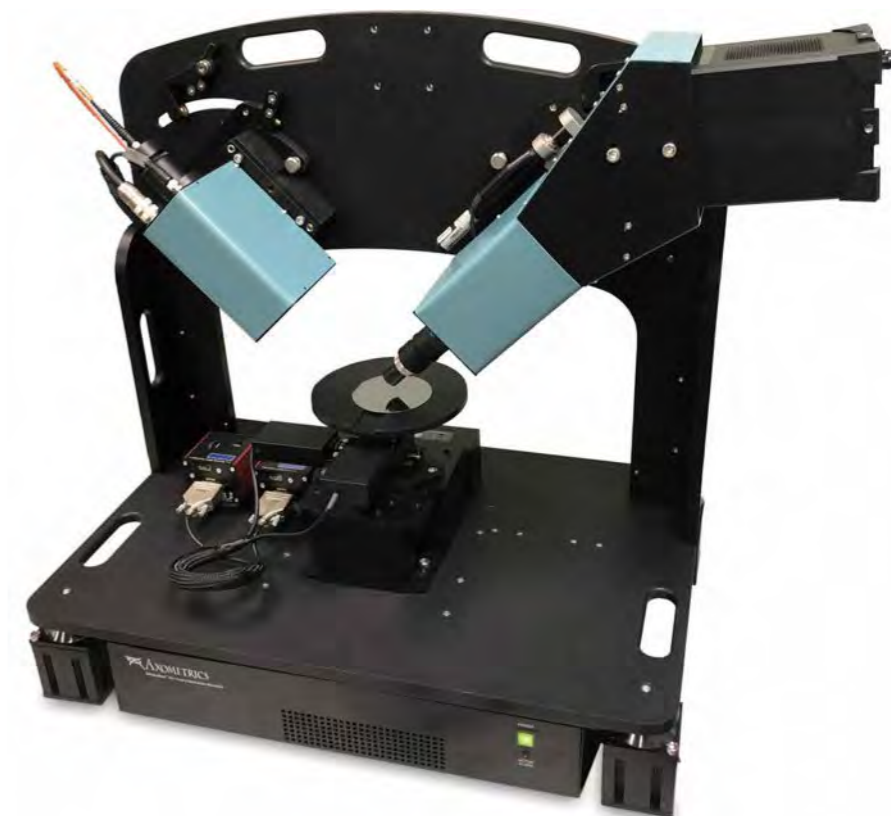
イメージングセンサーを搭載した微小領域測定タイプ。対物レンズを選択 / 搭載し、液晶ピクセルなどをミクロンオーダーの高空間分解能で微小エリアの偏光・位相差特性を一括測定します。



AxoScan-VRTF

ポラリメーター / エリプソメーター

透過・反射測定モデル。フィルム類の R0 や Rth、薄膜の n、k、厚みなど 1 台で様々な測定に対応します。AR / VR デバイス開発や 液晶配向膜 (PI) などの特性評価に対応可能です。



リターダンス

偏光解消

Fast 軸
方位

偏光

ミュラーマトリクス

R0, Rth

β角

セル厚、
プレチルト角、
ラビング角、
ツイスト角

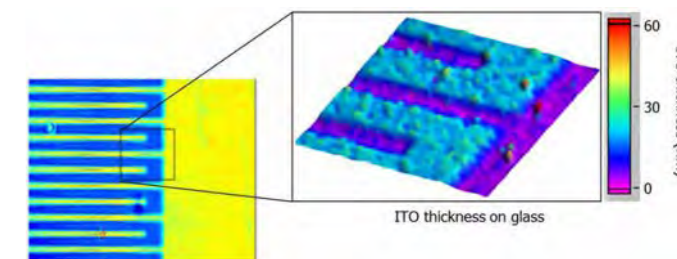
ポアンカレ球

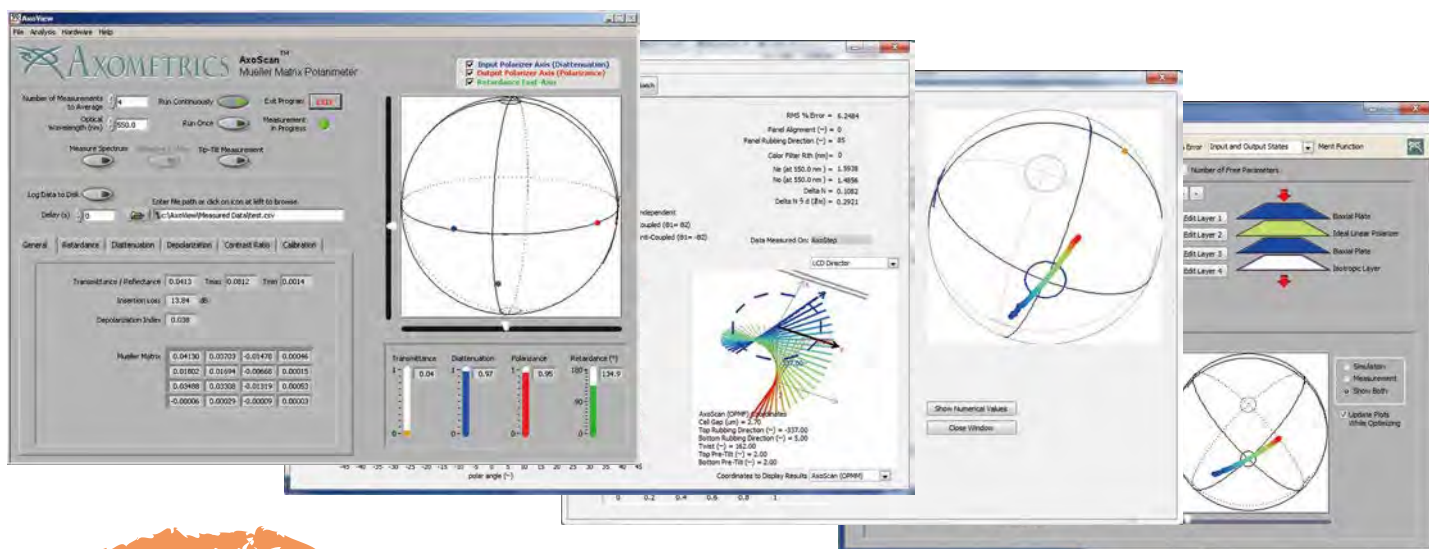
XY
マッピング

EllipsoStep

イメージングエリプソメーター

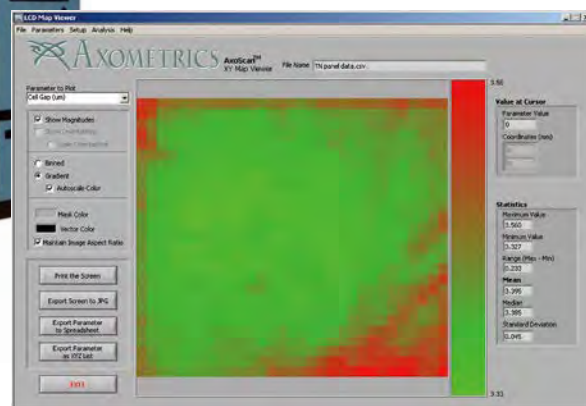
イメージングセンサーを搭載し、エリプソメトリーイメージ (Ψ、Δ) を 4 秒程度で測定します。薄膜の屈折率、厚み測定を微小領域で行えるシステムです。1μm 以下の空間分解能で測定を実行でき、視野領域を一括測定可能です。





アプリケーションソフトウェア

- ✓ メインプログラム
- ✓ 波長分散測定
- ✓ 多層フィルム非破壊測定
- ✓ 回転傾斜測定
- ✓ 液晶パネル測定
- ✓ 膜厚、屈折率測定 など



アプリケーションに合わせたハードウェア

大型フィルム・パネル測定システムは、上記ソフトウェア と使用することで、フィルム・パネルサンプル全面の標準的な偏光・位相差特性だけでなく、各種特性評価にも対応可能です。

記載内容および画像の転載、複製、加工などは禁止です。また、記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。 Ver.1.0_2404